

G01J 赤外線，可視光線または紫外線の強度，速度，スペクトル，偏光，位相またはパルスの測定；色の測定；放射温度測定〔2〕

注

（１）このサブクラスは他に分類されない赤外線，可視光線，紫外線の有無の検出を包含する。

（２）クラスG 0 1のタイトルに続く注に注意すること。

サブクラス内の索引

測光；高温計..... 1/00；5/00
分 光 測 定 ； 測 定 ； 偏 光 ； 速 度 ； 位 相 ； パ ル ス
..... 3/00；4/00；7/00；9/00；11/00

- 1/00 測光，例．写真の露出計（分光光度測定G 0 1 J 3／0 0；放射温度測定に特に適合するものG 0 1 J 5／0 0）
- 1/02 ・細部
- 1/04 ・・光学部分または機械部分
- 1/06 ・・・入射角の限定
- 1/08 ・・特に測光に適用される光源の構成
- 1/10 ・参照光，または電気値との比較によるもの
- 1/12 ・・全体的視覚手段によるもの（G 0 1 J 1／2 0が優先）
- 1/14 ・・・段階的輝度の表面との比較によるもの
- 1/16 ・・電氣的な放射線検出器によるもの（G 0 1 J 1／2 0が優先）
- 1/18 ・・・参照電気値との比較によるもの
- 1/20 ・・測定値または参照値の強度が検出器における効果と等しくなるように変えられるもの，例．入射角の変化によるもの
- 1/22 ・・・光路中に可変素子を使用するもの，例．フィルター，偏光手段（G 0 1 J 1／3 4が優先）
- 1/24 ・・・・電氣的な放射線検出器によるもの
- 1/26 ・・・・測定値または参照値の自動変化に適用されるもの
- 1/28 ・・・光源の強度または距離の変化によるもの（G 0 1 J 1／3 4が優先）
- 1/30 ・・・・電氣的な放射線検出器によるもの
- 1/32 ・・・・測定値または参照値の自動変化に適用されるもの
- 1/34 ・・・交互にまたは連続的に使用された分離光路によるもの，例．フリッカー
- 1/36 ・・・・電氣的な放射線検出器によるもの
- 1/38 ・全体的視覚手段によるもの（G 0 1 J 1／1 0が優先）
- 1/40 ・・可視限界または吸光効果によるもの
- 1/42 ・電氣的な放射線検出器によるもの（参照光または電気値との比較によるものG 0 1 J 1／1 0；光学および機械部分G 0 1 J 1／0 4）

- 1/44 ・・電気回路
- 1/46 ・・・コンデンサーによるもの
- 1/48 ・化学的效果によるもの
- 1/50 ・・指示器の色が変化するもの，例．化学光量計
- 1/52 ・・写真効果によるもの
- 1/54 ・・ガスの光反応を観察することによるもの
- 1/56 ・放射圧またはラジオメーターの効果によるもの
- 1/58 ・光により発生したルミネッセンスによるもの
- 1/60 ・目のひとみを測定することによるもの
- 3/00 分光測定；分光光度測定；モノクロメータ；色の測定〔4〕
- 3/02 ・細部
- 3/04 ・・スリットの構成
- 3/06 ・・走査装置の構成
- 3/08 ・・光線切換装置の構成
- 3/10 ・・特に分光測定または比色測定に適用される光源の構成
- 3/12 ・スペクトルの発生；モノクロメータ
- 3/14 ・・屈折素子，例．プリズム，によるもの（G 0 1 J 3／1 8，G 0 1 J 3／2 6が優先）
- 3/16 ・・・自動視準装置をもつもの
- 3/18 ・・回折素子，例．回折格子，によるもの
- 3/20 ・・・ローランド円分光計
- 3/22 ・・・リトロミラー分光計
- 3/24 ・・・特定次数のために設計された回折格子によるもの
- 3/26 ・・多重反射によるもの，例．ファブリーペロー干渉計，可変干渉フィルター
- 3/28 ・スペクトルの調査（色フィルターを用いるものG 0 1 J 3／5 1）〔4〕
- 3/30 ・・スペクトル上で直接スペクトル線強度を測定するもの（G 0 1 J 3／4 2，G 0 1 J 3／4 4が優先）
- 3/32 ・・・単一検出器によるスペクトルバンドの順次調査
- 3/36 ・・・別々の検出器によるスペクトル中の2以上のバンドの調査
- 3/40 ・・スペクトルの写真濃度の測定によるスペクトル線強度の測定；分光写真（G 0 1 J 3／4 2，G 0 1 J 3／4 4が優先）〔4〕
- 3/42 ・・吸収分光測定；二光束分光測定；フリッカー分光測定；反射分光測定（光線切換装置の構成G 0 1 J 3／0 8）〔4〕
- 3/427 ・・・二波長分光測定〔4〕
- 3/433 ・・・変調分光測定；微分分光測定〔4〕
- 3/44 ・・ラマン分光測定；散乱分光測定〔4〕
- 3/443 ・・発光分光測定〔4〕

3/447	・ ・ 偏光分光測定 [4]	5/54	・ ・ ・ 光学的特徴
3/45	・ ・ 干渉分光測定 [4]	5/56	・ ・ ・ 電気的特徴
3/453	・ ・ ・ 振幅の相互干渉によるもの [4]	5/58	・ ・ 吸収によるもの ; 偏光によるもの ; 減光効果によるもの
3/457	・ ・ 相関分光測定, 例. スペクトル強度の相関 (G 0 1 J 3 / 4 5 3 が優先) [4]	5/60	・ ・ 色温度の測定によるもの
3/46	・ 色の測定 ; 色測定装置, 例. 比色計 (色温度の測定 G 0 1 J 5 / 6 0) [4]	5/62	・ ・ 光をチョッピングする手段によるもの
3/50	・ ・ 電気的な放射線検出器によるもの [4]	7/00	光速度の測定
3/51	・ ・ ・ 色フィルターを用いるもの [4]	9/00	光学的位相差の測定 ; コヒーレンス度の決定 ; 光学的波長の測定 (分光測定 G 0 1 J 3 / 0 0) [3]
3/52	・ ・ 色標によるもの	9/02	・ 干渉法によるもの [3]
4/00	偏光の測定 [2]	9/04	・ 同一光源ではあるが異った周波数の 2 つの波のうなりおよび得られた低周波の位相の測定によるもの [3]
4/02	・ 視野分離形偏光計 ; 半影形偏光計 [2]	11/00	個々の光パルスまたは光パルス列の特性の測定 [5]
4/04	・ 電気的検出手段を利用する偏光計 (G 0 1 J 4 / 0 2 が優先) [2]		
5/00	放射温度計		
5/02	・ 細部		
5/04	・ ・ ケース		
5/06	・ ・ 妨害放射線の影響を除去するための構成		
5/08	・ ・ 光学的特徴		
5/10	・ 電気的な放射線検出器によるもの		
5/12	・ ・ 熱電素子によるもの, 例. 熱電対		
5/14	・ ・ ・ 電気的特徴		
5/16	・ ・ ・ 冷接点についての構成 ; 周囲温度または他の変化の影響の補償		
5/18	・ ・ ・ ・ 指示または記録のための特別な適用		
5/20	・ ・ 放射線に感ずる抵抗, サーミスタまたは半導体によるもの		
5/22	・ ・ ・ 電気的特徴		
5/24	・ ・ ・ ・ 特に適用された回路, 例. ブリッジ回路, の使用		
5/26	・ ・ ・ ・ 指示または記録のための特別な適用		
5/28	・ ・ 光電子放射セル, 光電導セル, または光起電力セルによるもの		
5/30	・ ・ ・ 電気的特徴		
5/32	・ ・ ・ ・ 指示または記録のための特別な適用		
5/34	・ ・ コンデンサーによるもの		
5/36	・ ・ ガスの電離によるもの		
5/38	・ 固体または流体の伸長または膨張		
5/40	・ ・ バイメタル素子によるもの		
5/42	・ ・ ゴレイセルによるもの		
5/44	・ ・ 共振周波数の変化によるもの, 例. 圧電結晶の		
5/46	・ 放射圧またはラジオメータの効果によるもの		
5/48	・ 全体的視覚手段によるもの		
5/50	・ 以下のサブグループに関する特別な技術によるもの		
5/52	・ ・ 参照値との比較によるもの, 例. 繊維消失型高温計		